

**ANEXO II**  
**Formularios normalizados**  
*Solicitud de prestación de servicios metrológicos*



MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO



**Centro Español de Metrología**

ID usuario:

Contraseña:  **IR >** **?**

---

**→ Sistema de Gestión de Expedientes**  Centro Español de Metrología  
: Cliente

Solicitudes Manuales > Solicitud Nueva

**Datos del Solicitante:**

Formato de recepción de la oferta:

CIF / NIF:  Persona Contacto:

Razón social:

Dirección:

Localidad:  Provincia:

País:  Código Postal:

Teléfono:  E-Mail:

Expediente	Estado	Nombre Servicio	Tipo Instrumento / Nombre Instrumento	Marca	Modelo	Número Serie / Identificador CEM	Precio
<input type="checkbox"/> 001	Incompleto	Juego de Masas Patrón Sartorius	Perfilometro Saxon				No aplicable
<input type="checkbox"/> 002	Completo	Comparador infométrico	Sistemas Infometricos...	Refractómetro (tracker)	Masa	122556560	€
<b>Total</b>							€

Comentarios:

---

**GESTIÓN >** | **Gestión de expedientes** | **Solicitudes Manuales**

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS  
*Solicitud de información a través de la Oficina de Atención al Ciudadano del CEM*



MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO



**Centro Español de Metrología**

ID usuario:

Contraseña:  **IR >** **?**

---

**BUSCAR >**

- Presentación
- Metrología
- Carta de servicios
- Legislación
- Oficinas virtual
- Actualidad
- Relaciones institucionales

OTRI

- Documentación en línea
- Utilidades
- Preguntas frecuentes
- Mapa del sitio
- Atención al ciudadano

Español | **Inglés**

W3C WAI-A WCAG 1.0

## Atención al ciudadano

**Enviar Consulta**

[Home > Enviar Consulta](#)

Para cualquier sugerencia o comentario sobre el Centro Español de Metrología, por favor cumplimente el siguiente formulario, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

**Datos de la consulta**

Unidad Destinataria:

Tipo Consulta:

Descripción:

**Datos del usuario**

Nombre:  Organización:

CIF/NIF:  Teléfono:

Fax:  E-mail:

Dirección:

Localidad:  Cod. Postal:

Provincia:

---

© Centro Español de Metrología / 2005